

Новейшие разработки в области аналитического оборудования для исследования и контроля качества материалов

Программа семинара

г. Санкт-Петербург, Гостиница «Октябрьская»
Лиговский проспект, д. 10, БКЗ, этаж 2

21-22
мая

В рамках проведения семинара состоится мастер-класс на оборудовании:

JPSpec /Китай/	Портативный спектрометр A450
JingPu /Китай/	Портативный спектрометр MX-2
Metal Power Analytical /Индия/	Мобильный оптико-эмиссионный спектрометр Metavision MX+
Metal Power Analytical /Индия/	Оптико-эмиссионный спектрометр Metavision 1008i3
Aczet /Индия/	РФА спектрометр для микроанализа StaRk
Optosky Photonics /Китай/	ИК-Фурье спектрометр ATP 8900 Plus
Tongda /Китай/	Рентгеновский дифрактометр TDM-20
Xenometrix /Израиль/	Рентгенофлуоресцентный спектрометр Vega
Melytec /Китай/	Анализатор кислорода, водорода, азота ONH-100
Melytec /Китай/	Анализатор серы и углерода CS-100
Sunny Optical /Китай/	Стереомикроскоп SZN71
Sunny Optical /Китай/	Инвертированный микроскоп ICX41M
Sunny Optical /Китай/	Прямой микроскоп RX50M
Zeptools /Китай/	Настольный сканирующий электронный микроскоп ZEM
Sinowon /Китай/	Твердомер по Виккерсу MicroVicky VH1010A
Trojan /Китай/	Автоматический настольный отрезной станок TableCut-200
Trojan /Китай/	Шлифовально-полировальный станок Alpha-600
Trojan /Китай/	Пресс для горячей запрессовки FlexPress-600
Мелитэк /Россия/	Электромеханическая настольная машина МЭС-Л-0.5
Jing Yi Gao Ke /Китай/	Дифференциальный сканирующий калориметр ZCR-1

09:30		Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк.
10:00	Иван Эразмович Анчевский	Приветственное слово от компании «Мелитэк».
10:20	Дмитрий Сергеевич Лебедев	Опико-эмиссионные спектрометры компании Metal Power Analytical (Индия). Новинка: Спектрометр Metavision RX.
10:50	Дмитрий Сергеевич Лебедев	Анализаторы CS/ONH компании Melytec (Китай) в современной металлообрабатывающей промышленности. Расходные материалы.
11:10	Дмитрий Сергеевич Лебедев	Портативные РФА спектрометры для экспресс-анализа различных материалов. Модель A450 компании JPSpec (Китай).
11:30		Перерыв. Кофе-брейк.
11:45	Анатолий Викторович Головков	Рентгенофлуоресцентные спектрометры компаний Melytec (Китай) и Xenometrix (Израиль). Пробоподготовка для рентгенофлуоресцентного анализа.
12:25	Анатолий Викторович Головков	Микрорентгенофлуоресцентные спектрометры для измерения толщин металлических покрытий и состава драгоценных металлов компании Aczet (Индия).
12:50		Обед.
13:50	Алексей Анатольевич Быков	Рентгеновские дифрактометры компании Tongda (Китай). Новинка: Дифрактометрические приставки для расширения аналитических возможностей оборудования.
14:20	Юлия Владимировна Крылова	Новые ИСП-ОЭС и ИСП-МС компании Melytec (Китай) для высокоточного высокопрецизионного анализа в рутинных исследованиях.
14:50	Марат Фанильевич Ахметов	ИК-Фурье и Раман-спектрометры для анализа органических веществ и полимерных материалов компании Optosky Photonics (Китай).
15:20		Перерыв. Кофе-брейк.
15:35	Дмитрий Сергеевич Лебедев	Системы промышленной рентгеновской томографии компании Sanying (Китай).
16:05	Марат Фанильевич Ахметов	Реометры и анализаторы текстуры компании Baosheng (Китай). Термоанализаторы Jing Yi Gao Ke (Китай) и анализаторы теплопроводности Zhenhua Analysis Instrument (Китай).
16:45	Доклад пользователя	Опыт эксплуатации анализатора.
17:00		Розыгрыш приза среди заполнивших опросные листы.
17:10		Завершение первого дня семинара. Фуршет.

Индивидуальная практическая работа с Вашими образцами на приборах (в течение дня) по предварительной записи.
Рекомендованное количество образцов для анализа не более 2-х.

22 мая

г. Санкт-Петербург
Гостиница «Октябрьская», Лиговский проспект, д. 10
БКЗ, этаж 2

09:30		Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк.
10:00	Ирина Николаевна Протасова	Приветственное слово от компании «Мелитэк».
10:10	Игорь Андреевич Афанасьев	Современные решения для пробоподготовки металлографических образцов Trojan (Китай). Новинка: Высокопроизводительный отрезной станок Beta 500.
10:50	Виталий Александрович Ханин	Оптические микроскопы Sunny Optical (Китай), обзор модельного ряда. Прямой исследовательский микроскоп RX50, металлографический инвертированный микроскоп ICX41M, стереомикроскоп SZX12.
11:20		Перерыв. Кофе-брейк.
11:35	Татьяна Александровна Сивкова (SIAMS)	Автоматизированные методы анализа микроструктуры материалов SIAMS.
12:15	Доклад пользователя	Опыт эксплуатации оборудования.
12:30	Виталий Александрович Ханин	Сканирующие электронные микроскопы Zeptools (Китай), Melytec (Китай). Новинка: Микроскоп последнего поколения ZEM 20 Zeptools.
13:10		Обед.
14:10	Ирина Николаевна Протасова	Твердомеры Sinowon (Китай). Обзор модельного ряда, технических возможностей и перспектив развития. Новинка: Твердомеры серии DigiRock.
14:50	Константин Николаевич Астахов	Универсальные испытательные машины компании Мелитэк (Россия). Современные системы для статических и усталостных испытаний.
15:50		Перерыв. Кофе-брейк.
16:05	Константин Николаевич Астахов	Магнитно-резонансные пульсаторы компании Мелитэк (Россия) для высокочастотных испытаний на усталость, выращивания трещин и определения K1C.
16:45		Розыгрыш приза среди заполнивших опросные листы.
17:00		Завершение семинара.

Индивидуальная практическая работа с Вашими образцами на приборах (в течение дня) по предварительной записи.
Рекомендованное количество образцов для анализа не более 2-х.